

1 1 6 6 X線装置の利用規程

2021年11月17日

- (1) 各研究室は、利用者の中から1名を研究室利用責任者として登録する。登録された研究室利用責任者の一覧を装置のそばに掲示する。年度開始時に研究室利用責任者を確認、更新するが、年度途中で交代の事由が生じた場合は、速やかに管理研究室（運用責任者）に連絡すること。

登録に際しては、研究室主催者の許可を得た上で、講習を受講するか、講習動画の視聴を行うこと。管理研究室（運用責任者）は、年度初めの講習会開催の他、研究室利用責任者の依頼に基づいて講習会を開くものとする。

- (2) 測定に際しては、研究室利用責任者の指導の下実施すること。トラブルが発生した際は、事の大小に拘わらず管理研究室に報告のこと。また、比較的軽度のトラブルに対しては「研究室利用責任者」が対応するとともに、管理研究室に報告のこと。

- (3) 原則として予約時間の上限は、昼間（10時～22時）は4時間、夜間（22時～翌朝10時）は12時間までとする。当初の予約時間よりも早く終わった場合には、次の予約研究室に終了した旨連絡すること。特殊測定で当初より4時間を超えた長時間の利用が必要と予想される場合は、管理研究室まで相談すること。

- (4) 本装置の使用料金は、5000円／サンプル（冷却器起動時間を含めず4時間以内程度）として課金する。測定希望者は希望日時をオンライン予約システム上で予約すること。本測定に進めなかった場合や unit cell 測定などは1000円／サンプルとして課金する。測定終了後、使用ノートに終了した時間およびサンプル数、その他の必要事項を記入すること。

以下のような測定を行う場合に、昼間は4時間、夜間は12時間を目安に「1サンプル」の測定を終えること。

- ・本測定に進む結晶を選別するための予備測定を複数回繰り返し、その後本測定に進んだ場合は1サンプルの測定を完了したのものとして5000円を課金する。ただし、予備測定を複数回繰り返し、結晶性等の観点から本測定に至らなかった場合、それらの予備測定は本測定選別に必要な作業として、まとめて1000円を課金する。
- ・構造の温度変化測定で複数回本測定を行った場合は、一連の温度変化を比較する必要性から、それらをひとまとめにして1サンプルとし、5000円を課金する。
- ・脱溶媒など構造の時間変化測定で複数回本測定を行った場合、溶媒脱離前後の比較が必要なものとして、それらをひとまとめにして1サンプルとし、5000円を課金する。
- ・同バッチ内の結晶の多形分布を調べるために予備測定を繰り返し、格子定数だけを求めた場合、それら一連の操作が多形比率の推定に必要なものとし、本測定には進んでいないため、予備測定を繰り返したのと同じ1000円を課金する。

- (5) 低温冷却装置は、温度安定に 60~120 分程度かかるので、予め冷却装置のスイッチを入れておくこと。測定終了後に予約システム上で次の予約研究室に冷却装置利用の有無を確認し、使用予定がない場合は冷却装置をOFFにすること。
- (6) メンテナンスや故障などがあった場合、オンライン予約システム上で管理研究室側から予約をキャンセルする場合がある。
- (7) X線装置では許可された所定の場所以外は触らないこと、装置を壊した場合には修理料金の課金や使用停止などもあり得る。特に
- ・冷却された気流が出る部分
 - ・ゴニオメーター
 - ・検出器
 - ・ビームストッパー
 - ・ビーム集光部 (X線源)
- 等は、繊細なので触らないこと。
- (8) ネット予約システム、使用ノートの記載し忘れや虚偽報告の場合、原則的に使用停止にする。
- (9) 使用時は常にフィルムバッジを着用し、被爆に関しては細心の注意を払うこと。

榎本研究室 (内線5780)